

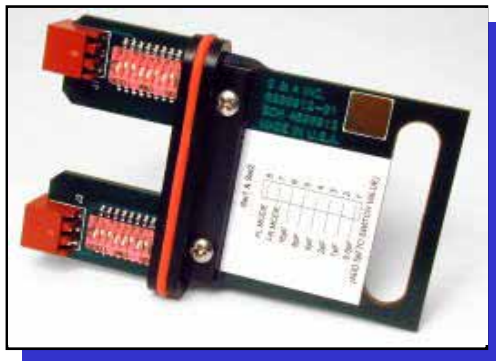
NEW

2列のテストヘッド

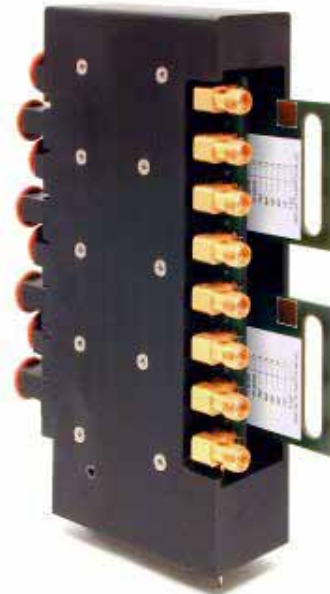
- 水晶振動子温度テストシステム向け
可変コンデンサ読み込みカードテストヘッドです。
- 読み込みカードのDIPスイッチは、
FRかFL計測のどちらかを選択できます。
- 実物を使用したFL計測は、0.5 pFステップで
5から37 pFを設定可能です。
- 不可欠な防湿層によってFLテストの
繰り返し精度をサポートします。
- 産業用標準テスト装置に相関を取るための
デザインに最適化されています。



4ディスクのテストヘッド



可変コンデンサ読み込みカード



サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>